

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
научного сотрудника
в лаборатории дифракционных методов исследования реальной структуры кристаллов.
Вакансия VAC 98615

Тематика исследований

Электронная микроскопия нано-гетероструктур, сверхтонких покрытий (графен), монокристаллов (нитридов и оксидов Al и Ga) и биоматериалов.

Трудовая деятельность

Проведение экспериментальных исследований методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), в том числе ПЭМ высокого разрешения.

Количественная обработка ПЭМ изображений.

Интерпретация данных, в том числе восстановление параметров объектов наблюдения.

Освоение новой информации, изложенной на английском и русском языках.

Написание статей для публикации в научных журналах.

Обучение студентов теоретическим и практическим знаниям для исследовательской работы методом ПЭМ.

Требования к претенденту

Высшее профессиональное образование.

Стаж научной работы по специальности не менее 5 лет.

Опыт работы на электронных микроскопах.

Наличие публикаций в научных журналах, входящих в ядро РИНЦ, WoS и индексируемых Scopus (не менее 15-20 за последние 5 лет).

Опыт работы в научных коллективах в условиях грантовой системы.

Опыт организации и проведения индивидуального научного исследования в условиях грантовой системы.

Конкретные обязанности будут определяться исходя из квалификации соискателя.

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 26 180

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 18 000

СТАВКА: 1,0

Срок трудового договора – 5 лет

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы:

- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- сведения о научной работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций;

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, ученому секретарю ФТИ им. А.Ф. Иоффе М.И. Патрову, телефон для справок: (812) 297 22 45.